

# 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学受託試験取扱要領

平成19年7月4日  
学 長 裁 定

## (趣旨)

第1条 この要領は、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学（以下「本学」という。）における学外からの依頼に応じて行う試験、分析等（以下「受託試験」という。）の取扱いに関し必要な事項を定める。

## (受入条件)

第2条 受託試験の受入れに当たっては、本学の研究及び教育に支障がなく、かつ、学外の学術研究機関、地域社会の要請に応える又は健全なる企業活動に資すると認められる場合に受け入れるものとする。

## (申込方法)

第3条 受託試験を委託する者（以下「委託者」という。）は、受託試験依頼書（別紙様式第1号）を学長に提出するものとする。

## (受入れの決定及び通知)

第4条 学長は、受託試験の受入れについて、可否を決定し、受託試験受託通知書（別紙様式第2号）により、委託者に通知するものとする。

## (料金)

第5条 受託試験の料金は、別表の受託試験料金表に定める料金に消費税及び地方消費税の相当額を加えた額（以下「受託試験費」という。）とするものとする。

2 受託試験費は、原則として、前納とする。ただし、本学が認めた場合は、受託試験の開始後に受託試験費を納付することができる。

## (試験実施責任者)

第6条 受託試験を実施する場合は、当該受託試験を実施する研究科又は学内共同教育研究施設に、当該受託試験の実施を指揮するものとして、試験実施責任者を置くものとする。

2 試験実施責任者は、当該受託試験を実施する研究科長又は学内共同教育研究施設長（以下「研究科長等」という。）が指名する職員をもって充てる。

## (中止等)

第7条 試験実施責任者及び委託者は、天災その他受託試験実施上やむを得ない事由があるときは、双方協議のうえ、受託試験の中止又は期間の延長を研究

科長等に申し出るものとする。

- 2 研究科長等は、前項の申出について、やむを得ない事由があると認めた場合は、当該受託試験の中止又は期間の延長を承認するものとする。
- 3 受託試験を中止又は期間を延長した場合において、原則として、納付された受託試験費は委託者に返還しない。
- 4 本学は、次の各号に掲げる事項について、委託者の受ける損害に対してその責を負わない。
  - (1) やむを得ない事由によって試験等を中止したため損害が生じたとき。
  - (2) 受託試験を行うために提出された材料等（以下「材料等」という。）に損害が生じたとき。
- 5 受託試験の実施上本学が必要と認めたときは、材料等の再提出を求めることができる。
- 6 材料等の搬入及び搬出は、すべて委託者が行うものとする。

（完了報告）

第8条 受託試験実施責任者は、当該受託試験が完了したときは、受託試験結果報告書（別紙様式第3号）を研究科長等に提出するものとする。

- 2 研究科長等は、前項の報告書を受け取ったときは、学長に報告するものとし、学長は、これにより、報告書を委託者に提出するものとする。

（秘密の保持等）

第9条 本学及び委託者は、受託試験の実施で知り得た相手方の秘密、知的財産等を相手方との書面による同意なしに開示及び漏洩してはならない。

- 2 前項の規定に関わらず、委託者は、受託試験結果及び当該受託試験より得られたデータについては、公表することができる。ただし、本学の名称又は本学を特定できる表現を含む場合は、学長の許可を得なければならない。

（受託研究取扱規程の準用）

第10条 この要領に定めるもののほか、受託試験の取扱いに関し必要な事項は、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学受託研究取扱規程（平成16年規程第30号）を準用する。

附 則

この要領は、平成19年7月4日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附 則

この要領は、平成26年5月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成29年2月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成29年9月16日から施行する。

附 則

この要領は、令和元年5月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和2年10月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和3年10月1日から施行する。

別紙様式第1号（第3条関係）

受付番号 号

### 受託試験依頼書

(元号) 年 月 日

国立大学法人

奈良先端科学技術大学院大学長 殿

住 所

〒 \_\_\_\_\_

委 託 者

印

(連絡先)

担当者（所属・氏名） \_\_\_\_\_

電話番号 \_\_\_\_\_

FAX 番号 \_\_\_\_\_

E-mail アドレス \_\_\_\_\_

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学受託試験取扱要領の内容を熟知の上、同要領第3条の規定に基づき、次のとおり依頼します。

供 試 物 品 名 及 び 数 量	品 名	数 量
依頼事項 (使用する機器名、供試物品に関する情報をできる限り簡潔に記載して下さい。)		
受 託 試 験 実 施 希 望 開 始 日	(元号) 年 月 日	
受 託 試 験 合 計 金 額	円	
料 金 内 訳	使用機器名 _____	
試 験 実 施 責 任 者		

※ 太線枠内を記入して下さい。

別紙様式第2号（第4条関係）

受付番号 号

### 受託試験受託通知書

(元号) 年 月 日

委託者

\_\_\_\_\_ 殿

国立大学法人  
奈良先端科学技術大学院大学長 印

(元号) 年 月 日付けで依頼のあった受託試験について次のとおり受託します。

供試物品名 及び数量	品名	数量
試験実施責任者氏名		
試験内容	*使用機器名等を記述	
受託試験費	(内 訳) _____ 円	
備考		

別紙様式第3号（第8条関係）

受付番号 号

## 受託試験結果報告書

(元号) 年 月 日

委託者

殿

国立大学法人  
奈良先端科学技術大学院大学長 印

(元号) 年 月 日付けで依頼のあった受託試験の結果は、次のとおりです。

供試物品名 及び数量	品名	数量
試験実施責任者氏名		
受託試験実施期間		
試験結果	別添のとおり	
備考		

## 受託試験料金表

機器名等 (メーカー名、型番)	項目	試験単位等	料金(円) (消費税を除く。)
透過型電子顕微鏡 (FEI Electron Optics Tecnai F30 Twin)	通常観察(生物種に限る。)	1時間	9,750
超高温キセノン四楕円鏡型 単結晶製造装置 (Crystal Systems FZ-T-12000-X-VPO-PC-YH)	単結晶サンプル育成 (原料セラミックス棒をユーザー が準備)	1検体 (8時間以内)	49,400
	単結晶サンプル育成及び 原料セラミックス棒作製	1検体 (8時間以内)	別途相談
ナノ秒レーザー加工装置 (Oxford Lasers Micromachining System A-series OFLS-532-10-A)	通常加工 (加工条件確定の為のテスト加工 を含む。)	被加工物 16 個以内 (8時間以内)	52,000
300kV透過電子顕微鏡(300kV-TEM) (JEOL JEM-3100FEF)	通常観察	1検体 (4時間以内)	300,000
	クライオサンプル観察	1検体 (4時間以内)	396,000
走査透過電子顕微鏡(STEM) (HITACHI HD-2700)	通常観察・EDX元素分析・EELS分 析・ナノビーム電子回折図形	1検体 (4時間以内)	374,000
超高分解能電界放出型電子顕微鏡 (FE-SEM) (HITACHI SU9000)	通常観察・EDX元素分析	1検体 (4時間以内)	109,600
	コーティングの追加	1検体	5,000
低真空分析走査電子顕微鏡 (HITACHI SU6600)	通常観察・EDX元素分析・EBSD分 析	1検体 (4時間以内)	77,400
	コーティングの追加	1検体	5,000
微小デバイス特性評価装置 (nanoEBAC) (HITACHI NE4000)	通常観察	1検体 (8時間以内)	540,000
走査プローブ顕微鏡(SPM) (HITACHI SPA400)	通常観察	1検体 (2時間以内)	21,200
二重収束型質量分析計(Sector) (JEOL JMS-700 MStation)	通常分析	1検体 (1時間以内)(※1)	16,000
	GC利用	1検体 (立ち上げを含む。)(※1)	80,000
		1検体 (上段同様試料で2検体目以降)(※1)	32,000
MALDI-TOFMS (Bruker autoflex II)	通常分析	1検体(1時間以内)(※1) (指定されたマトリックス1種を分析)	9,400
	マトリックスの追加	1マトリックス	2,400
MALDI-SpiralTOFMS (JEOL JMS-S3000)	通常分析	1検体(1時間以内)(※1) (指定されたマトリックス1種を分析)	14,400
	マトリックスの追加	1マトリックス	2,400

LC-TOFMS (JEOL JMS-T100LC AccuTOF)	通常分析	1検体 (1時間以内)(※1)	14,800
	カラム利用(LC条件提示あり) (※2)	1検体 (立ち上げを含む。)(※1)	103,600
		1検体 (上段同様試料で2検体目以降)(※1)	29,600
	カラム利用(LC条件提示なし) (※2)	1検体 (立ち上げ、条件検討を含む。)(※1)	162,800
1検体 (上段同様試料で2検体目以降)(※1)		44,400	
LC-TOFMS 高分解能飛行時間型質量分析装置 (JEOL AccuTOF LC-plus 4G, DART/ESI/CSI/APCI)	通常分析	1検体 (1時間以内)(※1)	14,800
	カラム利用(LC条件提示あり) (※2)	1検体 (立ち上げを含む。)(※1)	103,600
		1検体 (上段同様試料で2検体目以降)(※1)	44,400
	カラム利用(LC条件提示なし) (※2)	1検体 (立ち上げ、条件検討を含む。)(※1)	162,800
		1検体 (上段同様試料で2検体目以降)(※1)	44,400
	CSI測定	1検体(※1)	29,600
1検体 (上段同様試料で2検体目以降)(※1)		14,800	
X線構造解析装置 (Rigaku SmartLab9kW/IP/HY/N)	通常分析	1検体 (4時間以内)	40,000
微小結晶X線構造解析装置 (Rigaku VariMax RAPID RA-Micro7)	通常分析	1検体 (20時間以内)	218,000
600MHz超伝導NMR(※3) (JEOL JNM-ECA600)	通常分析	1検体(1H:30分以内) (その他(13C等)の場合、1検体の測定時間は3時間以内で、料金は右記の6倍とする。)	10,400
500MHz超伝導NMR(※3) (JEOL JNM-ECX500)	通常分析	1検体(1H:30分以内) (その他(13C等)の場合、1検体の測定時間は3時間以内で、料金は右記の6倍とする。1測定あたり3時間以内とする。)	7,800
400MHz固体超伝導NMR(※3) (JEOL JNM-ECX400P)	通常分析		7,800
電子スピン共鳴装置(ESR) (JEOL JES-FA100N)	通常分析	1検体 (4時間以内)	19,200
電子線マイクロアナライザ(EPMA) (SHIMADZU EPMA1610)	通常分析	1検体 (4時間以内)	120,000
二次イオン質量分析装置(SIMS) (ULVAC-PHI ADEPT-1010)	通常分析	1検体 (8時間以内)	106,800
多機能走査型X線光電子分光分析装置(XPS) (ULVAC-PHI PHI 5000 VersaProbe II)	通常分析	1検体 (8時間以内)	102,600
顕微レーザーラマン分光光度計 (JASCO NRS-4100)	通常分析	1検体 (4時間以内)	30,000
円二色性分散計(CD) (JASCO J-725)	通常分析	1検体 (3時間以内)	27,000



ダイナミック光散乱光度計 (Otsuka Electronics DLS-6000)	通常分析	1検体 (6時間以内)	50,400
分光エリブソメーター (HORIBA JOBIN YVON UVISEL ER AGMS-NSD)	通常分析	1検体 (2時間以内)	44,400
フェムト秒パルスレーザー (チタンサファイア)(※4) (Coherent Mira 900)	通常分析	1検体 (8時間以内)	110,400
サブナノ秒パルスレーザー (窒素)(※4) (USHO KEC-160)			
ストリークスコープ(※4) (HAMAMATSU C4780)			
全自動元素分析装置 (PerkinElmer 2400 II CHNS/O)	通常分析	1検体 (30分以内)	5,600
示差走査熱量計・示差熱重量同 時測定装置 (HITACHI DSC 7000X/ STA 7200)	通常分析	1検体 (4時間以内)	36,000
熱/電気物性評価装置(物性評価装 置: PPMS) (Quantum Design PPMS EverCool II)	通常分析	1検体 (8時間以内)	65,400
大気中光電子分光装置 (RIKEN KEIKI AC-3)	通常分析	1検体 (1時間以内)	17,800
分光感度・内部量子効率測定装置 (BUNKOUKEIKI CEP-2000RP)	通常分析	1検体 (2時間以内)	30,000

(※1) 1検体では、ポジティブモード又はネガティブモードのどちらか1モードでの測定となる。

両モードの測定を希望する場合は、2検体となる。

(※2) 本学のカラムを利用する場合は、1検体あたり1,000円の追加料金が発生する。

また、本学で移動相を準備する場合は、1検体あたり500円の追加料金が発生する。

(※3) 溶液試料測定に用いる重水素化溶媒は、依頼者が用意する。

(※4) 利用機器の使用数にかかわらず、1検体あたりの料金とする。

・受託試験料金表に定めるもののほか、標準測定時間を超過する場合や、特別な観察又は分析に必要な処理を行う場合は、別途実費相当額を徴収することがある。